

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

SEMICON KOREA 2025 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 2 月 19 日(水)～2 月 21 日(金)にソウル市 COEX コンベンションセンターで開催される「SEMICON KOREA 2025」に出展します。



今回の展示会では、IGBT/SiC 向けパワー半導体検査装置や EV/HEV 等の駆動モータ用テストベンチ、当社子会社のニデック SV プローブが開発・製造を手掛ける Wafer 検査用治具「プローブカード」等の最新ソリューションを出展いたします。当社の核となる「はかる」ことを体現してきた、半導体プローブカード、半導体パッケージ基板電気検査システム「GATS シリーズ」やパワー半導体電気検査システム「NATS シリーズ」を中心に紹介いたします。

これまで培ってきた検査技術をベースに、最新の検査ソリューションと未来に貢献する新製品・新技術を提案いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2025 年 2 月 19 日(水)～2 月 21 日(金)
- ・会 場：ソウル市 COEX コンベンションセンター
- ・ブ ー ス：3 階 Hall C C600
- ・公式サイト：<https://www.semiconkorea.org/en>

〈出展内容〉

- ・高電圧対応加圧構造プローブカード
- ・高温/高電流対応プローブカード
- ・2D-MEMS プローブカード
- ・IGBT/SiC モジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置「NATS-1000/1700 シリーズ」
- ・KGD テスト装置「NATS-1300 シリーズ」
- ・パワー半導体モジュール用動的信頼性試験装置「NATS-8000 シリーズ」
- ・リファレンスインバーター
- ・EV 駆動モータ用テストベンチ「TDAS シリーズ」
- ・半導体パッケージ基板電気検査システム「GATS-7000 シリーズ」
- ・AI サーバー大型基板電気検査システム「GATS-8360」
- ・AC/DC マルチテスター「R-700 シリーズ」
- ・超高精度検査用ピンプローブ